Б.Ф. Азаров

Статья посвящена вопросу количественной оценки техногенной нагрузки на геологическую среду урбанизированных территорий. На примере застройки двух микрорайонов г. Барнаула выполнен сравнительный анализ изменения техногенной нагрузки на исследуемой территории, заложенной в проекте застройки и при его реализации. Сравнивая результаты расчета количественных показателей воздействия техногенной нагрузки на геологическую среду, полученные для проекта застройки, с аналогичными показателями, рассчитанными уже для застроенной территории, оценивается степень изменения техногенной нагрузки.

Ключевые слова: техногенная нагрузка, геологическая среда, грунтовые условия.

ВВЕДЕНИЕ

Одной из основных задач геоэкологических исследований урбанизированных терриявляется оценка инжерерногеологических условий городов и прогноз их изменения под влиянием антропогенных процессов. В связи с этим целесообразно рассмотреть и дать оценку влияния на геологическую среду различных источников техногенного воздействия. Для выявления закономерности пространственного распространения и характера изменчивости техногенных воздействий исследуемой территории, а также для оценки степени разнонаправленности техногенного воздействия используются количественные показатели - коэффициенты распределения площадной и линейной техногенной нагрузки K_{PTH} и $K_{PЛH}$ [2]. Такая оценка проводилась для кварталов 2000, 2001 г. Барнаула в 2000 г. на основе проектов застройки и планов внутриквартальных наружных сетей [1]. Дополнительно определялись значения суммарного коэффициента техногенной нагрузки в качестве обобщенной величины техногенного воздействия. В 2010 г. был повторен расчет тех же количественных показателей техногенной нагрузки по материалам, характеризующим фактическую реализацию проекта застройки указанных микрорайонов с целью сравнения техногенной нагрузки на геологическую среду урбанизированной территории «проектной» (рассчитанной по проекту планировки и застройки и плану инженерных сетей до реализации проекта застройки) и «фактической» (рассчитанной по рабочей документации на застройку и коммуникации после реализации проекта застройки).

В геоморфологическом отношении территория находится в пределах Приобского плато. Юго-восточная часть описываемого района приурочена к переходной зоне собственно плато к ложбине древнего стока р.Барнаулки. Абсолютные отметки участка изменяются в пределах от 191 до 201 м.общий уклон местности на юго-восток. В геологическом отношении район представлен мощной толщей четвертичных отложений. На основе данных инженерно-геологических изысканий геологическое строение представлено до глубины 6-13 м покровными лессовидными суглинками и супесями верхнечетвертичного возраста. Покровные суглинки распространены в пределах собственно плато, супеси - в переходной зоне плато к долине древнего стока.

По материалам изысканий прошлых лет грунтовые воды до глубины 20 м не встречены. Следует отметить, что в замкнутых понижениях рельефа за счет аккумуляции поверхностных вод имеет место замачивание грунтов до водонасыщенного состояния.

Субаэральные покровные лессовидные суглинки и супеси обладают просадочными свойствами при замачивании от дополнительной внешней нагрузки или собственного веса.

В 1991 г. «АлтайТИСИзом» для исследуемой территории была составлена карта просадочности грунтов . В пределах описываемой территории (кварталы 2000,2001) имеются районы распространения грунтовых условий І-го и ІІ-го типа по просадочности. Область І-го типа по просадочности имеет преимущественное распространение как в суглинках, так и в супесях. Область распро-

странения II-го типа по просадочности ограниченна. Он развит только в лессовидных с частыми прослойками песков пылеватых супесях переходной зоны на востоке и юговостоке исследуемой территории.





Рисунок 1 – Объемно-планировочное решение застройки кварталов 2000 (а) и 2001 (б)

Территория кварталов 2000,2001 является районом застройки юго-западной части г.Барнаула. Микрорайон 2000 расположен в Индустриальном районе г. Барнаула и ограничен улицами Малахова, Балтийской, Лазурной и Взлетной. Для формирования внутренних пространств микрорайона использованы 7-ми и 10-ти этажные жилые дома, которые в сочетании с 2- 3-х этажными объемами школы, детского сада, объектов куль-

турно-бытового обслуживания увеличивают количество композиционных приемов, позволяющих добиться разнообразия в застройке. В ансамбль застройки микрорайона включены пять четырехэтажных паркингов емкостью 290 машино-мест каждый, совмещенных с комплексами обслуживания населения на первом уровне (торговля, бытовое обслуживание).

Микрорайон 2001 расположен в Индустриальном районе г. Барнаула и ограничен улицами Лазурной, Балтийской, Малахова и проездом Северный Власихинский.

Южный периметр улицы Балтийской решается в комплексе с северным ее периметром - застройкой микрорайона 2000, разрабатываемой одновременно с 2001-м микрорайоном.Для формирования внутренних пространств микрорайона использованы 5-ти, 10ти и 14-ти этажные жилые дома, которые в сочетании с 2- 3-х этажными объемами школы, детского сада, объектов культурнобытового обслуживания увеличивают количество композиционных приемов, позволяющих добиться разнообразия в застройке. В ансамбль застройки микрорайона включены четыре четырехэтажных паркинга емкостью 290 машино-мест каждый, совмещенных с комплексами обслуживания населения на первом уровне. Для постоянного хранения автомобилей граждан на территории микрорайона, кроме четырех четырехэтажных паркингов предусмотрены подземные гаражи, запроектированные в комплексе с погребами. Общая емкость подземно-наземных гаражей составит 1 510 машино-мест. Количественная оценка техногенной нагрузки для территории микрорайонов 2000 и 2001 была выполнена в работе [2].

В результате были определены коэффициенты суммарной техногенной нагрузки на геологическую среду кварталов 2000 и 2001, которые представлены в таблице 1.

Согласно результатам исследования [1], схемы распределения площадной, линейной и суммарнойтехногенной нагрузки, а также их процентное отношение, показаны на рисунках 2,3,4.

Аналогичный расчет был выполнен по фактически реализованному проекту застройки кварталов 2000, 2001 на 2010 г в пределах тех же единиц площади (квадратов). Результаты расчета и их графическая интерпретация соответственно представлены в таблице 2, а также на рисунках 5-7.

АЗАРОВ Б.Ф.

Таблица 1 – Количественные показатели источников техногенного воздействия [2]

№ квадрата	Количественный показатель источников техногенного воздействия		Название диапазона техноген-ной нагруз- ки	Масшта- бный ко- эффи- циент, Р	Коэффици-ент распреде- ления сум- марной техно- ген-ной на- грузки,
1	2	3	4	5	6
		Квартал 2	2000, 2000 г.		
A1	K _{PTH}	0,28000	высокая	16	0,0684
711	К _{РЛН}	0,05300	средняя	1	0,0004
A2	K _{PTH}	0,33500	высокая	14	0.0784
· · <u>-</u>	Крлн	0,06005	средняя	1	0.0.0
A4	K _{PTH}	0,26900	высокая	14	0.0746
	Крлн	0,05875	средняя	1	
A5	K _{PTH}	0,29600	высокая	11	0.0883
	КРЛН	0,07635 0,23300	средняя	1 12	
Б2	K _{РТН} К _{РЛН}	0,23300	высокая	12	0.0801
	К _{РТН}	0,32000	средняя Слабая	10	
Б3	КРЛН	0,0196	средняя	1	0.0469
	K _{PTH}	0,23300	высокая	12	
Б5	КРЛН	0,06675	средняя	1	0.0795
	Кетн	0,22000	Средняя	10	
B1	Келн	0,03650	средняя	1	0.0532
_	K _{PTH}	0,34800	Средняя	10	
B5	К _{РЛН}	0,03750	средняя	1	0.0657
	Кртн	0,21700	средняя	10	0.0000
Г3	К _{РЛН}	0,02105	слабая	1	0.00389
	Кртн	0,36400	высокая	16	0.0000
Γ4	Крлн	0,05155	средняя	1	0.0699
Г5	K _{PTH}	0,21200	Слабая	10	0.0421
	К _{РЛН}	0,02515	средняя	1	
			2001, 2000 г		
A4	K _{PTH}	0,2032	высокая	1	0,0660
A 4	К _{РЛН}	0,0269	средняя	1	0,0000
A5	K _{PTH}	0,2406	высокая	12	0.0819
A0	К _{РЛН}	0,0687	средняя	1	0.0013
Б3	K _{PTH}	0,2979	средняя	10	0.0671
	К _{РЛН}	0,0440	средняя	1	0.007 1
Б4	K _{PTH}	0,2146	высокая	14	0.0700
	К _{РЛН}	0,0597	средняя	1	
Б5	K _{PTH}	0,2086	высокая	12	0.0899
	К _{РЛН}	0,0726	средняя	1 10	
B3	Кртн	0,3446	средняя	10	0.0703
	Келн	0,0429	средняя	1 10	- 0.0528
B4	K _{PTH}	0,2318	средняя	10	
	КРЛН	0,0349	средняя	10	
Γ2	K _{PTH}	0,2694 0,0463	Средняя	10 1	0.0666
Γ4	K _{РЛН} K _{РТН}	0,0463	средняя высокая	12	
	К _{РЛН}	0,2809	средняя	1	0.0869
Д2	К _{РТН}	0,0707	Высокая	14	0.0742
	КРЛН	0,0615	средняя	1	
Д3	K _{PTH}	0,2471	высокая	12	0.0858
	Келн	0,0724	средняя	1	
Д4	K _{PTH}	0,3244	Слабая	10	0.0496
11:	КРЛН	0,0221	средняя	1	5.5.50

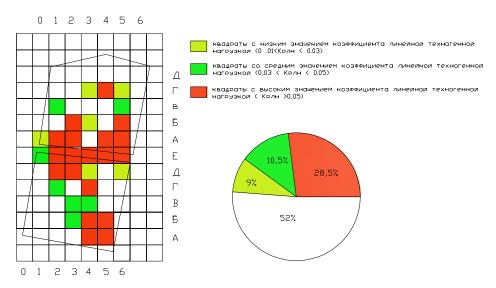


Рисунок 2 – Распределение линейной техногенной нагрузки на 2000 г

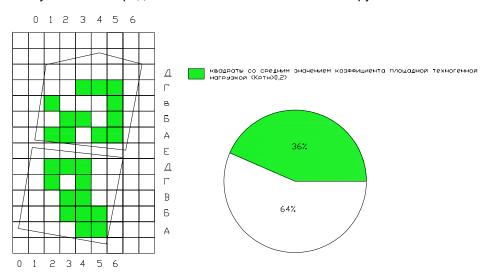


Рисунок 3 – Распределение площадной техногенной нагрузки на 2000 г

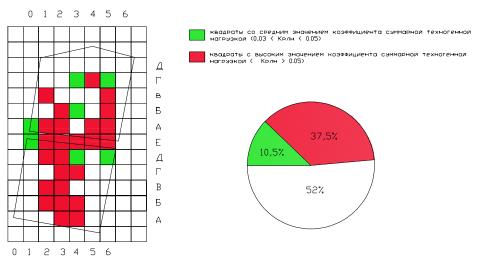


Рисунок 4 – Распределение суммарной техногенной нагрузки на 2000 г

АЗАРОВ Б.Ф.

Таблица 2 – Расчет коэффициентов суммарной техногенной нагрузки кварталов 2000-2001 на 2010 г

№ квадрата	Количественный показатель источников техногенного воздействия		Название диапазона техногенной нагруз- ки	Мас- штабный коэффи- циент, Р	Коэффициент распределения суммарной техногенной нагрузки,	
1	2	3	4	5	6	
Квартал 2000, 2010 г						
A1	K _{PTH}	0,0509	Отсутствует	1	0.0000	
	К _{РЛН}	0,535	высокая	1	0,2929	
40	K _{PTH}	0,15705	отсутствует	1	0.047	
A2	К _{РЛН}	0,477	высокая	1	0,317	
4.0	K _{PTH}	0,319136	средняя	3	0.4000	
A3	К _{РЛН}	0,306	высокая	1	0,4688	
A4	K _{PTH}	0,406498	средняя	3	0.507	
A4	К _{РЛН}	0,297	высокая	1	0,527	
A5	Кртн	0,2255	Средняя	3	0,474	
AS	К _{РЛН}	0,406	высокая	1	0,474	
A6	Кртн	0,6563	средняя	3	0,870	
Au	К _{РЛН}	0,504	высокая	1	0,670	
Б1	К _{РТН}	0,182	Отсутствует	1	0,265	
	К _{РЛН}	0.348	высокая	1	1, 11	
	K _{PTH}	0,3111	Средняя	3		
Б2	Крлн	0,264	высокая	1	0,431	
	КРТН	0,2312	Средняя	3		
Б3	Крлн	0,35	Высокая	1	0,4359	
Б4	К _{РТН}	0,2135	Средняя	3	0,541	
	К _{РЛН}	0.45	высокая	1	,	
	K _{PTH}	0,20315	средняя	3		
Б5	Крлн	0,64	высокая	1	0,633	
F.0	K _{PTH}	0,41435	Средняя	3	2 222	
Б6	К _{РЛН}	0,687	высокая	1	0,826	
D.4	K _{PTH}	0,0592	Отсутствует	1	0.407	
B1	К _{РЛН}	0,276	высокая	1	0,167	
DO	Кртн	0,296946	Средняя	3	0.707	
B2	К _{РЛН}	0,686	высокая	1	0,737	
D.0	K _{PTH}	0,0923	отсутствует	1	0.400	
В3	К _{РЛН}	0,18	высокая	1	0,136	
D.4	K _{PTH}	0,191	Отсутствует	1	0.070	
B4	К _{РЛН}	0,368	высокая	1	0,279	
D.F.	K _{PTH}	0,104	отсутствует	1	0.242	
B5	К _{РЛН}	0,582	высокая	1	0,343	
De	K _{PTH}	0,60665	Средняя	3	0,947	
B6	К _{РЛН}	0,656	высокая	1	0,947	
Г1	K _{PTH}	0,0039	отсутствует	1	0,059	
<u> </u>	К _{РЛН}	0,115	высокая	1	0,059	
Г2	Кртн	0,1991	Средняя	3	0,547	
1.4	К _{РЛН}	0,531	высокая	1	0,047	
Г3	K _{PTH}	0,19055	средняя	3	0,455	
	К _{РЛН}	0,417	высокая	1	0,400	
Г4	K _{PTH}	0,1813	отсутствует	1	0,265	
14	К _{РЛН}	0,358	высокая	1	0,200	
Г5	K _{PTH}	0,1406	отсутствует	1	0,233	
1 5	К _{РЛН}	0,352	высокая	1	0,200	
Г6	K _{PTH}	0,3745	Средняя	3	0,752	
	К _{РЛН}	0,628	высокая	1	·	
1	2	3	4	5	6	
Д1	K _{PTH}				0,156	
<u>Д</u> ।	К _{РЛН}	0,156	высокая	1	0,100	

_				•	1
Д2	K _{PTH}	0,06114	отсутствует	1	0,28
	К _{РЛН}	0,499	высокая	1	0,20
ДЗ	K _{PTH}	0,178743	отсутствует	1	0,394
	К _{РЛН}	0,609	высокая	1	0,394
Д4	K _{PTH}	0,296186	средняя	3	0,583
	К _{РЛН}	0,481	высокая	1	0,565
Д5	K _{PTH}	0,3246	средняя	3	0.040
	К _{РЛН}	0,492	высокая	1	0,613
Д6	K _{PTH}	0,2672	средняя	3	0.5040
	К _{РЛН}	0,402	высокая	1	0,5019
	K _{PTH}	0,25	Средняя	3	2.000
E1	К _{РЛН}	0,18	высокая	1	0,322
_	Кртн	0,5436	средняя	3	
E2	Крлн	0,0605	высокая	1	0,453
	КРТН	0,13647	отсутствует	2	
E3	Келн	0,0375	средняя	1	0,116
	K _{PTH}	0,30495	средняя	3	
E4	КРЛН	0,137	высокая	1	0,332
	K _{PTH}	0,1478		1 1	
E5			отсутствует	1	0,106
	К _{РЛН}	0,0638	высокая		
E6	K _{PTH}	0,469	средняя	1	0,47
	К _{РЛН}	-	-	-	·
	1.4		001, 2010 г	T -	T
A1	K _{PTH}	0,11575	Высокая	2	0,156
	К _{РЛН}	0,11925	отсутствует	1	5,100
A2	K _{PTH}	0,2196	Средняя	2	0,227
,	К _{РЛН}	0,121	высокая	1	0,227
А3	K _{PTH}	0,2861	средняя	2	0,258
710	К _{РЛН}	0,1015	высокая	1	0,200
A4	K _{PTH}	0,348	средняя	2	0,352
A4	К _{РЛН}	0,17325	высокая	1	0,332
٨٥	K _{PTH}	0,39415	средняя	2	0.424
A5	К _{РЛН}	0,238	высокая	1	0,421
A.C.	K _{PTH}	0,293175	средняя	2	0.000
A6	К _{РЛН}	0,0505	средняя	1	0,229
F.4	K _{PTH}	0,16265	отсутствует	1	0.400
Б1	К _{РЛН}	0,233	высокая	1	0,198
	К _{РТН}	0,1738	отсутствует	1	
Б2	К _{РЛН}	0,2	высокая	1	0,187
	K _{PTH}	0,1626	отсутствует	1	
Б3	КРЛН	0,1277	высокая	1	0,145
		0,2266		2	
Б4	К _{РТН} К _{РЛН}	0,23825	средняя высокая	1	0,31
	К _{РТН}	0,4997		2	
Б5		0,4997	средняя	1	0,585
	КРЛН		Высокая	2	
Б6	K _{PTH}	0,340725	Средняя		0,261
	Келн	0,0515	высокая	1	
B1	K _{PTH}	0,279	средняя	2	0,375
	К _{РЛН}	0,2837	высокая	1	
B2	K _{PTH}	0,12744	отсутствует	1	0,121
	К _{РЛН}	0,115	высокая	1	-,
B3 B4	K _{PTH}	-	-	-	_
	К _{РЛН}	-	-	-	
	K _{PTH}	0,219075	средняя	2	0,294
	К _{РЛН}	0,22175	высокая	1	0,234
B5	K _{PTH}	0,3223	Средняя	2	0,413
	К _{РЛН}	0,297	высокая	1	0,413
1	2	3	4	5	6
	K _{PTH}	0,5839	средняя	2	
B6	К _{РЛН}	0,07	высокая	1	0,435
Г1	Кетн	0,1435	отсутствует	1	0,1435
	INPIN	0, 1700	OTOSTOTOSCI	<u> </u>	0,1700

	К _{РЛН}	-	-	-	
Г2	K _{PTH}	0,2233	средняя	2	0,149
	К _{РЛН}		отсутствует	1	
Г3	K _{PTH}	0,220625	средняя	2	0,147
	К _{РЛН}		отсутствует	1	
Ε4	K _{PTH}	0,2424	Средняя	2	0,217
Г4	К _{РЛН}	0,0825	высокая	1	
Г5	K _{PTH}	0,225	средняя	2	0,413
13	К _{РЛН}	0,394	высокая	1	0,413
Г6	K _{PTH}	0,3454	средняя	2	0,318
10	К _{РЛН}	0,13125	высокая	1	
Д1	K _{PTH}	0,11493	отсутствует	2	0,223
Д'	К _{РЛН}	0,2195	высокая	1	
Д2	K _{PTH}	0,2195	Средняя	2	0,304
	К _{РЛН}	0,236	высокая	1	
ДЗ	K _{PTH}	0,3302	средняя	2	0,357
	К _{РЛН}	0,205	высокая	1	
Д4	K _{PTH}	0,3356	средняя	2	0,391
	К _{РЛН}	0,2515	высокая	1	
Д5	K _{PTH}	0,3512	средняя	2	0,382
	К _{РЛН}	0,222	высокая	1	
Д6	K _{PTH}	0,3038	Средняя	2	0,370
	К _{РЛН}	0,251	высокая	1	

Согласно рисункам 6-8, для кварталов 2000 и 2001 территория, в пределах которой коэффициент суммарной техногенной нагрузки имеет низкие значения, составляет 39%, средние значения - 51%, высокие значения - 10% от общей площади застройки.

Сопоставление границ территории кварталов 2000, 2001, где коэффициенты площадной и линейной техногенной нагрузки превышают средние значения, с картой просадочности грунтов (рисунок 9) показывает, что основная застройка квартала 2000 приходится на грунты І-го типа просадочности, а застройка квартала 2001 — на грунты ІІ-го типа просадочности. В процентном отношении территория кварталов 2000, 2001 включает:

- **43,4%** грунты І-го типа по просадочности при 1 см < σ_{2q} <5 см;
- **10,6%** грунты І-го типа по просадочности при $\sigma_{2q} = 0;$
- 46,0% грунты II-го типа по просадочности.

Сравнивая результаты расчета количественных показателей воздействия техногенной нагрузки на геологическую среду, выполненные в 2000г по проекту застройки, с аналогичными показателями, полученными для уже застроенной территории кварталов 2000 и 2001, можно оценить степень изменения техногенной нагрузки (фактической на 2010 г. по сравнению с проектируемой на 2000 г).

Согласно полученным результатам, линейная нагрузка увеличилась с 48% до 85%. При этом увеличилась доля участков с высокой нагрузкой, которая составляет 82%.

Площадная нагрузка в 2000 году имела

только средние значения и занимала 36% общей площади застройки, на 2010 г. ее площадь составила 64%, причем появились участки с ее высоким коэффициентом нагрузки, площадь которых равна 1,5% от общей плошади застройки. Выполненная оценка техногенной нагрузки на геологическую среду исследуемой территории показала, что в настоящее время наибольшему влиянию подвержены участки, насыщенные линейными сооружениями. В квартале 2001 это район детского сада, в квартале 2000 - район средней школы. На этих участках суммарная техногенная нагрузка оценивается как слабая, так как на территории этих участков доля площадных объектов невелика. На территории кварталов 2000,2001 по ул. Балтийской на 2010 г. преобладает средняя суммарная техногенная нагрузка, а по ул. Малахова - высокая, преимущественно за счет большого количества линейных сооружений (автодорога, трамвайные пути, подземные коммуникации).

Территория, занятая площадными объектами (жилой и административно-бытовой застройкой), в основном подвержена средней суммарной техногенной нагрузке.

На основании вышеизложенного приходим к выводу о том, что дальнейшее насыщение территории кварталов 2000, 2001 линейными и площадными объектами застройки нецелесообразно, так как техногенная нагрузка на этой территории может достичь пороговых значений, что необходимо учитывать при дальнейшей реализации проекта застройки, а также при эксплуатации зданий и сооружений.

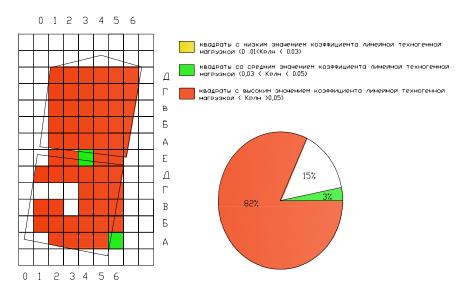


Рисунок 5 – Распределение линейной техногенной нагрузки на 2010 г

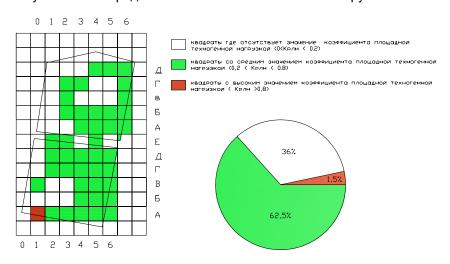


Рисунок 6 – Распределение площадной техногенной нагрузки на 2010 г

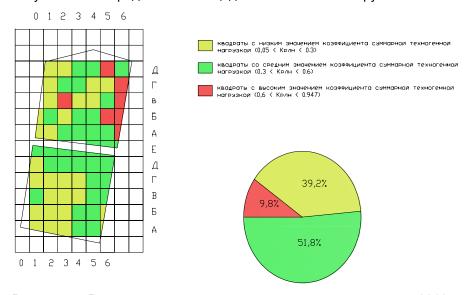


Рисунок 7 – Распределение суммарной техногенной нагрузки на 2010 г

АЗАРОВ Б.Ф.

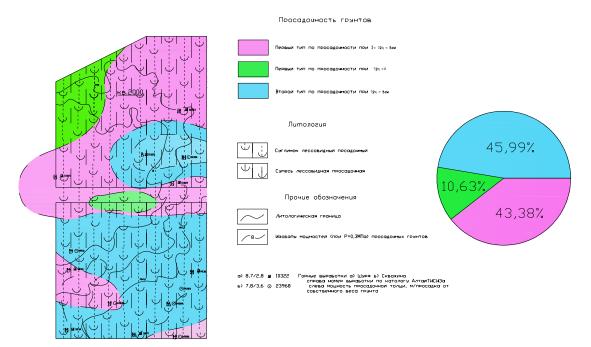


Рисунок 8 – Карта просадочности грунтов для территории кварталов 2000 и 2001 в г. Барнауле

Анализ застройки кварталов совместно с картой просадочности грунтов (рисунок 8) показал, что средняя суммарная техногенная нагрузка (т.е. совместная нагрузка от зданий и подземных инженерных сетей) приходится, согласно проекту застройки, на значительную часть территории, где имеют распространение слабые, структурно неустойчивые грунты, которые составляют 46% площади застройки. Это, безусловно, отрицательно скажется на нормальной эксплуатации зданий и подземных коммуникаций.

При дальнейшей реализации проекта застройки квартала 2001, в грунтовых условиях II типа, рекомендуются мероприятия по устранению просадочных свойств грун-

тов или прорезка просадочной толщи сваями.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. Цоцур Е.С., Коллегова О.Г., Зиангиров Р.С., Груздов А.В. Картирование и анализ техногенных воздействий на территории города // Инженерная геология. 1992. №5 С. 98-103.
- 2. Азаров Б.Ф., Кузнецова С.М., Клейнос Г.А Количественная оценка техногенной нагрузки объектов коммунального хозяйства на геологическую среду // Вестник АлтГТУ им. И.И. Ползунова 2000. №1. С. 93-100.